



**ประวัติส่วนตัว:**

1. ชื่อ นายมานอชญ์ นามสกุล เสงวัตตะนะ  
Mr. Manoch Hengwattana
2. รหัสประจำตัว 427/39/1001
3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
4. ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา	ระดับปริญญา	สาขา	ชื่อสถาบันการศึกษา	ประเทศ
2537	ปริญญาตรี	ฟิสิกส์	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ประเทศไทย
	ศึกษาศาสตร์บัณฑิต			
	กศ.บ			
2541	ปริญญาโท	ฟิสิกส์	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ประเทศไทย
	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต			
	วทม.			

**ประสบการณ์ในการรับทุนไปฝึกอบรมต่างประเทศ:**

1. เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการ Thailand-Australia Science & Engineering Assistance Project / TASEAP Subprogram Material Science , 2000 March-May

2. เข้ารับการฝึกอบรม XRF 2002 SHORT COURSE IN MODERN X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY, University of Western Ontario, Canada, 10-21 June 2002 โดยได้รับเงินทุนจากสำนักงานโครงการเงินกู้ทบวงมหาวิทยาลัย

3. ได้รับทุน โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ หมวดเงินอุดหนุน จากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ XIX CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY , Geneva , Switzerland , 6-15 August 2002

**Academic Responsibility :**

Lecturer                      Physics Department Srinakharinwirot University                      1996-present

**ประสบการณ์ :**

งานสอน :

- Introductory Physics
- Modern Physics
- Basic Physics Laboratory
- Mathematics for Physics

- Thermal and Statistical Physics
- Mechanics
- Nuclear Physics
- Advanced Physics Laboratory
- Physics Seminar
- Physics Project

งานวิจัย :

- Prompt Gamma-Ray Neutron Activation Analysis
- Whole Rock Analysis by X-Ray Fluorescence Technique
- Study of the Matrix Effect on Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis in Slag
- Sensor and Catalyst
- Sciences Education in Physics

งานที่ตีพิมพ์ :

บทความตีพิมพ์ :

M. Hengwattana , S. Kweangsopa , and A. Intasorn , A PROMPT GAMMA-RAY NEUTRON ANALYSIS FOR QUANTITATIVE POTASSIUM DETERMINATION , 23<sup>rd</sup> Conference on Science and Technology of Thailand , 1997 , p1046.

Arune Intasorn , Nirun Witit-anun , Manoch Hengwattana , Chakapan Thawornthira , THE FEASIBILITY SURVEY OF Cu THIN FILM THICKNESS MEASUREMENT BY X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS, 27<sup>th</sup> Conference on Science and Technology of Thailand , 2001 , p 297.

A. Intasorn, W. Sunghirun and M. Hengwattana, QUANTITATIVE ANALYSIS OF TRACE ELEMENTS IN SOIL USING WAVELENGTH-DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER, 40<sup>th</sup> Kasetsart University Annual Conference, 2002 p 236- 241.

A. Intasorn, N. Witit-anun and M. Hengwattana, COPPER THIN FILM THICKNESS MEASUREMENT USING X-RAY DIFFRACTOMETER AND X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETERS, Science International, Vol14 No.4, 2002 p275-278.

A. Intasorn, M. Hengwattana, Synthesis of Calibration Standard Sets for Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis in Slag, Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Vol 13 No 3, 2005 p 39-46.